



独立实验室批准证书

范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 24.0001

CB 证书号: IECQ-L 2024.006

附件号: IECQ-L CEP 24.0001-S

版本号: 3

颁发日期: 2024/10/24

第 1 页 共 1 页

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)
		序号	名称	
1	电工电子产品/电子 半导体产品	1	外观目检	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2009.2
		2	开封实验	军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB- 4027B-2021 中 1103 中 2.6.2
		3	扫描电子显微镜 SEM 检 查	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2018.2
		4	去层试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.3.3
		5	电性验证试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.3.3.2.4
		6	红外扫描试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4 (d)
		7	剖面分析试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.3.2
		8	探针试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.12
		9	电子束显微分析	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4.e

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 www.iecq.org 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司

广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)

